



B3224

1.6T ビットエラーレートテスタ

▲ 製品説明

B3224は物理層の特性評価と一貫性試験のための高性能ビットエラーレートテスタ (BERT) です。PAM4/NRZ信号に対応し、1.6TBASE/CEI-224G規格をカバーします。優れた信号品質、豊富な機能、柔軟な試験モード (統合 MCBまたはリモートヘッド) により、高速シリアル回路製品の研究開発から製造試験まで、高い性能を確実に実現します。

▲ 主要仕様

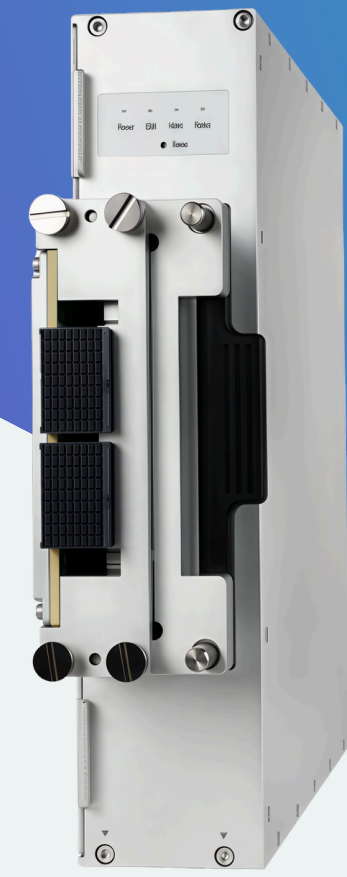
データレート	24.33 ~ 120 Gbaud
出力信号	差動 PAM4/NRZ (AC結合)
出力振幅	800 mVp-p (差動)
立上り/立下り時間	< 4.5 ps
入力信号	差動 PAM4/NRZ (AC結合)
受信感度	150 mVp-p (差動)
テストパターン	PRBS各種, SSPRQ, JP03A/B, Square Wave, カスタム定義パターン
クロックモード	内蔵クロックリカバリ
コネクタ	MXPD/SMPX
寸法 (mm)	412 x 441 x 112

▲ BERT シリーズ

型番	チャンネル数	最大レート (ch毎)	製品名/主な用途	形状・タイプ
BB3112	8	112G (50G Burst)	50G バースト誤り率測定器 (PON/OLT試験用)	ベンチトップ
B3112	8	112G	8x112G ビットエラーアナライザ (400G/800G用)	ベンチトップ
MB1016K	2	1.6T 合計	1.6T 2ch 光モジュールテスタ	モジュール型/ATE
MB2016K	4	1.6T 合計	1.6T 4ch 光モジュールテスタ	モジュール型/ATE
B3224	8	224G	8x224G ハイエンド誤り率測定器 (1.6T 次世代開発)	高性能ベンチトップ
MB2800	4	800G 合計	800G 4ch 光モジュールテスタ	モジュール型/ATE

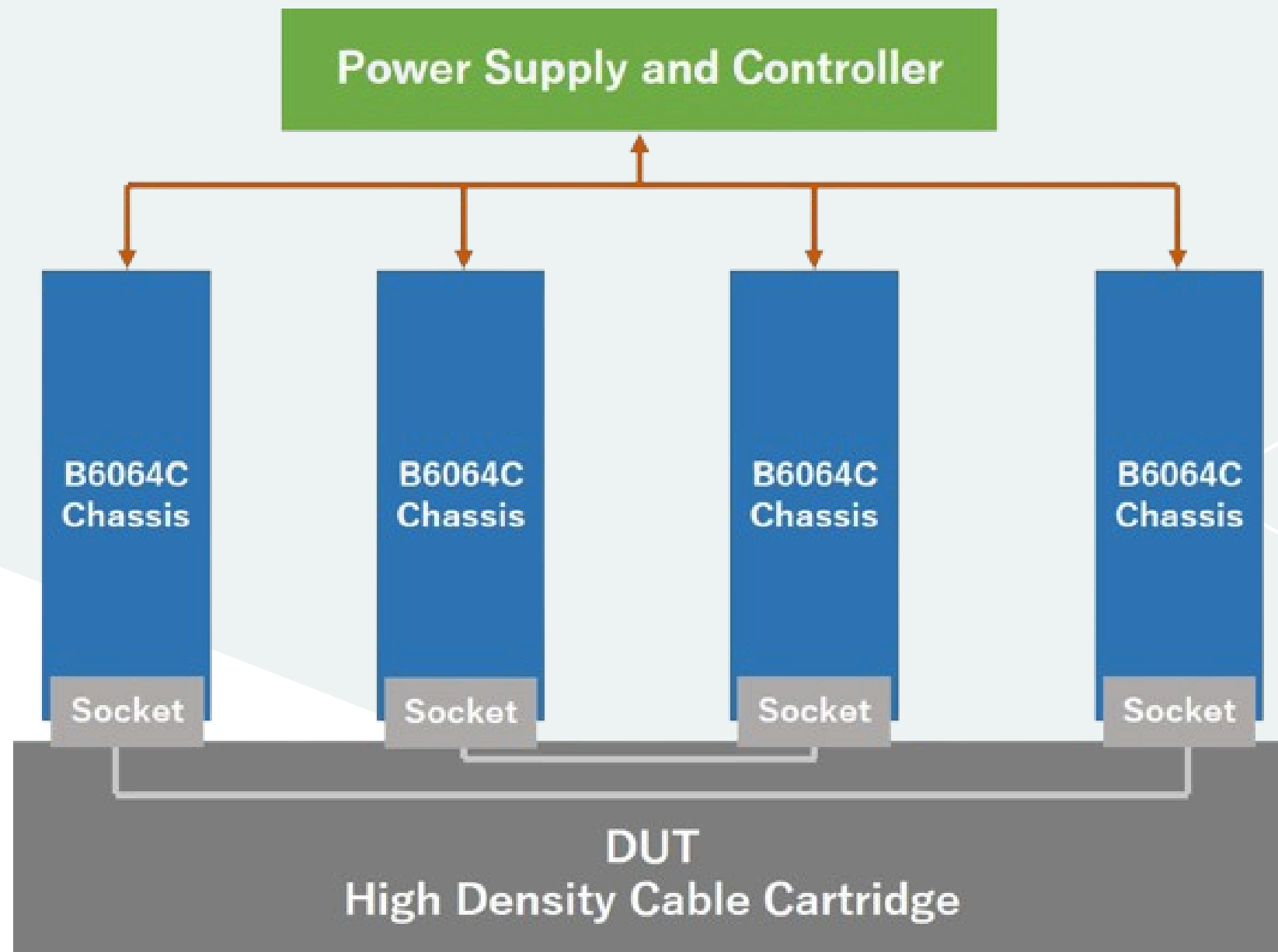
B6064C

PCIe 高速ケーブルBERT



▲ 製品説明

B6064CはPCIe 6.0およびそれ以前の規格に準拠した高速ケーブルのビットエラーレート（BER）試験に対応する、高密度で汎用性の高いソリューションです。最大64レーン（128差動ペア）の高密度試験、自動リンクトレーニング、最大40dBの挿入損失補償機能を備え、高速PCIeケーブルの研究開発、検証、製造試験に最適です。このソリューションは、データセンターのインターコネクトにおける包括的なシステムレベルのシグナルインテグリティ検証を可能にし、ケーブルメーカーやシステムインテグレーターに不可欠な品質保証を提供します。



▲ 主要仕様

テストユニット	2 x 64 ペア TRx
ターミナル	AC 結合
対応レート	64GT/s, 32GT/s, 16GT/s, 8GT/s, 5GT/s, 2.5GT/s
プロトコル準拠	PCIe 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.0
テストパターン	PRBS7-31
被測定デバイス (DUT) タイプ	PCIe データレートの高速ケーブル
システム損失バジェット	Die-to-die 40dB @ 64 GT/s (BER < 1E-6)
TX イコライゼーション	4 タップ FIR